народном хозяйстве». М., 1986. С. 59. [8] Глонти В. Н., Приезжев А. В., Степанян А. С.//Тез. докл. IV Всесоюз. шк. «Применение лазеров в биологии». Кишинев, 1986. С. 49.

Поступила в редакцию 01.12.87

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3, ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1989. Т. 30, № 2

ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА

УДК 538.913-405

ИЗУЧЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ГРЮНАЙЗЕНА ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ МОД Кварца, алмаза, кремния и германия

Е. К. Захарова, Л. П. Осипова

(кафедра общей физики для физического факультета)

Проведен расчет значений изобарических γ_i^P и изотермических γ_i^T микроскопических постоянных Грюнайзена кристаллов кварца, алмаза, кремния и германия и разделен вклад фонон-фононных взаимодействий и теплового расширения кристалла в температурный сдвиг частоты изученных фононов.

Температурные изменения частоты нормальных колебаний решетки ω_i являются ангармоническим эффектом. При этом температурная зависимость ω_i определяется как тепловым расширением кристалла за счет изменения межатомных силовых постоянных, так и изменением собственной энергии фононов вследствие фонон-фононных взаимодействий (при постоянном объеме V).

В работе [1] для учета вклада фонон-фононных взаимодействий в температурный сдвиг частоты фононов была использована теория возмущений с учетом членов 3-го и 4-го порядков в разложении потенциальной энергии решетки. Однако полученное при этом выражение довольно сложно и неудобно для сопоставления с экспериментальными данными.

Рядом авторов [2, 3] * предложена приближенная методика оценки вклада фонон-фононных взаимодействий в температурный сдвиг ω_i на основе введения микроскопических постоянных Грюнайзена: изохорической γ_i^{ν} , изотермической γ_i^{T} и изобарической γ_i^{P} . При этом

$$\gamma_i^P = -\frac{1}{\alpha\omega_i} \left(\frac{\partial\omega_i}{\partial T}\right)_P,\tag{1}$$

где а — коэффициент объемного теплового расширения,

$$\gamma_i^T = -\frac{1}{\chi_T \omega_i} \left(\frac{\partial \omega_i}{\partial P} \right)_T, \tag{2}$$

где χ_T — изотермическая сжимаемость кристалла при постоянной температуре T, т. е. γ_i^P определяется температурной зависимостью ω_i , а γ_i^T — зависимостью ω_i от приложенного внешнего давления P. Микроскопическая постоянная γ_i^V характеризует величину фонон-фононного взаимодействия и равна

$$-\frac{1}{\alpha\omega_i}\left(\frac{\partial\omega_i}{\partial T}\right)_V.$$

* Подробнее см. в нашей работе [4].

66

В квазигармоническом приближении * между микроскопическими постоянными Грюнайзена существует следующая связь [3]:

 $\gamma_i^P = \gamma_i^V + \gamma_i^T.$

Из уравнения (3), в частности, следует, что если найти значение γ_i^T (например, из экспериментальной зависимости ω_i от P или теоретических оценок) и значение γ_i^P (например, из температурной зависимости частоты ν линии спектра комбинационного рассеяния (КР) кристалла), то можно определить величину γ_i^V и, таким образом, оценить степень влияния фонон-фононных взаимодействий на температурную зависимость частоты оптического фонона.

В настоящей работе с использованием литературных данных была проведена оценка значений постоянных Грюнайзена для оптических мод алмаза, кремния и германия. Кроме того, были уточнены значения γ_i^T для кварца, полученные нами ранее [5, 6], с учетом последних сведений о сжимаемости кварца [7].

Кварц. В табл. 1 приведены значения γ_i^T , рассчитанные нами по формуле (2) с учетом зависимости v линий спектра КР от *P* из работы [8]. Значение χ_T было принято равным (2,3±0,1) 10⁻³ (подробнее см. в [4]). Полученные значения γ_i^T хорошо согласуются со значениями γ_i^T из недавней работы [9], которые приведены во 2-м столбце табл. 1. В 3-м столбце даны значения γ_i^P из нашей работы [6], а в последнем – оценка значений $\gamma_i^V = \gamma_i^P - \gamma_i^T$.

Таблица 1

(3)

ν, см ⁻¹	γ_i^T (при $P = 20$ кбар)	$\boldsymbol{\gamma}_i^T$ [9]	γ_i^P [6] (при $T = 500$ K)	$\gamma_i^V = \gamma_i^P - \gamma_i^T$
128 206 266 357 466 696 1159	$1,7\pm0,253,8\pm0,30,9\pm0,4(0,06)0,8\pm0,10,5\pm0,2(-0,1)$	$ \begin{array}{r} 1,7\\3,2\\0,8\\0\\0,8\\0,4\\-0,05\end{array} $	$7\pm1 \\ 11\pm1 \\ 2\pm0,3 \\ 0,7\pm0,3 \\ 1,0\pm0,1 \\ 0,7\pm0,2 \\ -$	$5,3\pm1,37,2\pm1,31,1(0,6)0,20,2(0,1)$

Эти результаты позволяют обсудить вклад фонон-фононных взаимодействий в температурный сдвиг частоты линий, а следовательно, и оптических фононов, связанных с ними. Из табл. 1 следует, что для линий спектра КР кварца с v > 350 см⁻¹ $\gamma_i^T \approx \gamma_i^P$ и, следовательно, роль фонон-фононных взаимодействий мала. Для линий 128, 206 и 266 см⁻¹ значение γ_i^V больше единицы, поэтому в температурный сдвиг частоты этих линий заметный вклад дают фонон-фононные взаимодействия. Действительно, как было показано в работе [10], температурное смещение частоты линий 128, 206 и 266 см⁻¹ определяется трех- и четырехфононными взаимодействиями. Следует отметить, что линия 206 см⁻¹, которая является «мягкой модой» [11], имеет наибольшие значения γ_i^P , γ_i^T и γ_i^V по сравнению с другими линиями спектра КР, что может свидетельствовать о сильной ангармоничности данного колебания.

Таким образом, с увеличением частоты линий спектра КР кварца вклад фонон-фононных взаимодействий в температурный сдвиг частоты уменьшается.

^{*} Это приближение применимо в случае небольших давлений, при которых зависимость ω_i от давления линейная, и вдали от фазовых переходов.

Алмаз, кремний и германий. Имеющиеся в настоящее время теоретические и экспериментальные данные для алмаза, кремния и германия, т. е. кристаллов со структурой алмаза, позволяют оценить вклад фонон-фононных взаимодействий в температурное смещение частоты оптических фононов для этих кристаллов.

В спектре КР 1-го порядка кристаллов алмаза, кремния и германия присутствует одна линия (соответственно с частотой 1333, 525 и 306 см⁻¹ при температуре 0 К), которая связана с трижды вырожденным фононом из центра зоны Бриллюэна, имеющим симметрию Γ_{25} [12—14]. Данные о значении γ_i^P для оптических фононов этих кристаллов в литературе отсутствуют, тогда как значения γ_i^T рассчитывались или определялись экспериментально неоднократно [2, 15—19].

В частности, из работ [15—18] следует, что для алмаза при невысоких давлениях * и комнатной температуре $\gamma_i^T = 1,1\pm0,15$. Для кремния $\gamma_i^T = 1,00\pm0,05$, а для германия $\gamma_i^T = 1,1\pm0,10$ [2, 19] (подробнее см. в работе [4]).

Определение значений γ_i^P для оптических фононов алмаза, кремния и германия проводилось по формуле (1) с использованием экспериментальных температурных зависимостей частоты γ линий спектра КР этих кристаллов, которые были найдены в литературе. Значения коэффициента теплового расширения α брались из работы [21].

Как оказалось, для алмаза есть только две работы [22, 23], в которых были измерены зависимости v(T). Однако в области высоких температур ход этих кривых несколько различен (рис. 1), поэтому для расчета γ_i^P нами использовались усредненные данные.



Рис. 1. Температурная зависимость частоты оптического фонона алмаза. Квадраты — данные [22], крестики — [23], пунктир — усредненная кривая

Рис. 2. Температурная зависимость частоты оптического фонона кремния и германия. Экспериментальные данные для кремния: кружочки [13], треугольники [24], квадраты [25] и для германия: ромбы [14], пунктир — усредненная кривая

^{*} Нелинейная зависимость частоты линий КР алмаза от давления (и как следствие, увеличение γ_i^T) наблюдается при P > 350 - 400 кбар [18, 20].

В табл. 2 представлены рассчитанные значения у^P для алмаза для нескольких интервалов температур. Из табл. 2 следует, что для оптического фонона алмаза в интервале температур 300—900 К

Таблица 2

<i>т</i> , қ	0-300	300-500	500-700	700—900	800-1000
γ ^P _i	3,3±1,7	1,7 <u>±</u> 0,4	1,8 <u>+</u> 0,3	2,1±0,3	2,4 <u>+</u> 0,3

 $\gamma_i{}^P \simeq 2,0 \pm 0,3$. Сравнение этого значения $\gamma_i{}^P$ со значением $\gamma_i{}^T$ показывает, что величина $\gamma_i{}^V$, характеризующая фонон-фононные взаимодействия, меньше или равна $\gamma_i{}^T$. Отсюда можно сделать вывод, что до температур ~900 К вклад фонон-фононных взаимодействий в температурный сдвиг частоты оптического фонона алмаза невелик и почти сравним с вкладом теплового расширения решетки кристалла.

На рис. 2 приведены температурные зависимости частоты линии 525 см⁻¹ (для кремния) [13, 24, 25] и линии 306 см⁻¹ (для германия) [14]. При расчете γ_i^p для кремния была использована усредненная кривая.

Таблица З

<i>т</i> , к	100-300	300-500	500—700	700-900	900-1100
$\gamma_i^P(Si)$	6,7 <u>+</u> 2,3	4,7±1,1	4,8 <u>+</u> 0,9	5,0 <u>+</u> 1,0	4,9±1,2
γ_i^P (Ge)	2,8 <u>+</u> 0,3	4,35±0,9	4,7 <u>+</u> 0,8		

Как следует из табл. 3, для кремния $\gamma_i^P = 4,9 \pm 1,0$ (в области 300—1100 К), а для германия $\gamma_i^P = 4,5 \pm 0,9$ (в области температур 300—700 К).

Сравнение значений γ_i^P и γ_i^T с учетом соотношения (3) показывает, что величина γ_i^V , характеризующая фонон-фононные взаимодействия, составляет 3,9 для кремния и 3,4 для германия, т. е. довольно велика. Следовательно, в области температур 300—1100 К для кремния и 300—700 К для германия заметный вклад в температурное смещение частоты оптических фононов этих кристаллов дают фонон-фононные взаимодействия. Действительно, как было показано в работах [25, 26], температурная зависимость частоты оптического фонона кремния в этой области температур хорошо описывается с учетом совместных вкладов трех- и четырехфононных взаимодействий. Если учесть, что значения γ_i^T и γ_i^P для кремния и германия примерно совпадают, то очевидно, что вывод, сделанный в [25, 26] для кремния, справедлив и для германия.

Следует заметить, что величина γ_i^P для оптических фононов кремния и германия более чем в 2 раза больше γ_i^P оптического фонона алмаза. Это может служить еще одним свидетельством «жесткости» решетки алмаза. Теоретические оценки [17] также показывают, что силы между ближайшими соседними атомами в алмазе менее ангармоничны, чем в кремнии и германии.

Таким образом, в настоящей работе определены изобарические микроскопические постоянные Грюнайзена у_ге для оптических мод

69

алмаза, кремния и германия и на основе сравнения у^P с изотермическими микроскопическими постоянными Грюнайзена уг для этих мод проведено разделение вклада фонон-фононных взаимодействий и теплового расширения кристаллов в температурный сдвиг частоты оптических фононов этих кристаллов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ [1] Maradudin A. A., Fein A. E.//Phys. Rev. 1962. 128. Р. 2589. [2] So-ma T.//Phys. Stat. Solidi (b). 1977. 82. Р. 319; J. Phys. Soc. Japan. 1977. 42. Р. 1491. [3] Tolpadi S.//Solid State Comm. 1975. 16, N. I. P. ; Indian J. Phys. 1975. 49. P. 757. [4] Захарова Е. К., Осипова Л. П. Деп. ВИНИТИ № 3650-85 Деп. М., 1985. [5] Захарова Е. К., Зубов В. Г., Захарова Е. К., Осипова Л. П.// //Bестн. Моск. ун-та. Физ. Астрон. 1977. 18, № 4. С. 38. [7] Jorgensen J. D.// //J. Appl. Phys. 1978. 49, N 11. Р. 5473. [8] Aseli J. F., Nicol M./J. Chem. Phys. 1968. 49. Р. 5395. [9] Ваггол Т. Н. К., Collias J. F., Smith T. W., Whi-te G. K.//J. Phys. C: Solid State Phys. 1982. 15. Р. 4311. [10] Кундикова Н. Д. Цис... канд. Физ.-мат. наук. М. (MГУ), 1979. [11] Горелик В. С., Иванова С. В., Осипова Л. П. Преприят ФИАН СССР № 58. М., 1982. [12] Solin S. A., Ram-das A. K.//Phys. Rev. 1970. B I. Р. 1687. [13] Нагт Т. R., Aggarwal R. L., Lax B.//Phys. Rev. 1970. B I. Р. 688. [14] Ray R. K., Aggarwal R. L., Lax B.// //Proc. 2 Int. Conf. on Light Scatt. Solids, 1971. Paris, 1971. Р. 288. [15] Miti-ra S. S./J. Pure and Appl. Phys. 1971. 9, N 11. Р. 922. [16] Drickamer H. D., Lynch R. W., Clendenen R. L., Revez - Albuerne E. A.//Solid State Physics. 1966. 19. Р. 135. [17] Рагѕол В. J.//Diamond Res. 1976. 33. Р. 33, Proc. Roy. Soc. (London). 1977. A352. Р. 397. [18] Александров И. В., Гончаров А. Ф., Ститов С. М./Письма в ЖЭТФ. 1986. 44, № 10. С. 474. [19] Buchenauer C. J., Cerdeira F., Cardona M./Proc. 2 1nt. Conf. on Light Scatt. Solids, 1971. Paris, 1971. Р. 280. [20] Напfland М., Syassen К., Fahy S., Louie S. G., Co-hen M. L.//Phys. Rev. 1985. B31, N 10. Р. 6396. [21] Новикова С. И.//Тепловое расширение твердых тел. М., 1974. С. 33. [22] Borer W. J., Mitra S. S., Namijo-shi K. V.//Solid State Comm. 1971. 9. Р. 1377. [23] Anastassakis E., Hwrang H. C., Perry C. H.//Phys. Rev. 1983. B28, N 4. Р. 1928. [26] Наго Е., Bałkan-ski M., Wallis R. F.//Phys. Rev. 1986. B34, N 8. Р. 5358.

Поступила в редакцию 28.10.87

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3, ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1989. Т. 30, № 2

УДК 592.315

влияние низкоэнергетического электронного облучения на ФЛУКТУАЦИОННЫЙ РЕЛЬЕФ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА Si-SiO₂

С. Н. Козлов, А. Ю. Потапов

(кафедра общей физики для химического факультета)

Показано, что низкоэнергетическое электронное облучение может значительно изменить флуктуационный рельеф границы раздела Si—SiO2 и увеличить плотность «флуктуационных» поверхностных электронных состояний границы раздела.

Одним из актуальных и вместе с тем дискуссионных вопросов физики поверхности полупроводников и структур полупроводник --диэлектрик — металл является выяснение роли флуктуационного рельефа поверхностного потенциала полупроводника в формировании энергетического спектра поверхностных электронных состояний (ПС). По-видимому, можно считать установленным, что для кремния — достаточно широкозонного полупроводника — область энергетического